

제KT219호 (1/3)

국제공인시험기관인정서

기 관 명 : 큐알티 주식회사(청주)

사업장소재지 : 충북 청주시 흥덕구 대신로 215

법인등록번호 : 134411-0059857

사업자등록번호 : 126-86-75409

최초인정일자 : 2004년 4월 19일

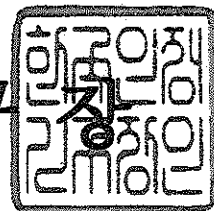
유효기간 : 2016년 6월 22일 ~ 2020년 6월 21일

인정분야 및 범위 : 별첨

상기 시험기관을 국가표준기본법 제23조 및 KS Q ISO/IEC 17025 인정 요건에 의거하여 국제공인시험기관으로 인정합니다. 또한 ISO-ILAC-IAF 공동성명(2009.1.8)에 언급된 바와 같이 인정된 분야 및 범위에 대한 기술적 능력과 시험기관 품질경영시스템이 적절함을 인정합니다.

2016년 6월 22일

한국인정기구





제KT219호 (2/3)

03. 전기시험

03.014 환경 및 신뢰성

규격번호	규격명	시험범위 또는 검출한계
AEC-Q100-005-REV-D1: 2012	NON-VOLATILE MEMORY PROGRAM/ERASE ENDURANCE, DATA RETENTION, AND OPERATIONAL LIFE TEST (제외) 3.6 Measurements 4 Failure criteria	55 °C ~ 150 °C
AEC-Q100-008-REV-A: 2003	EARLY LIFE FAILURE RATE (ELFR) (제외) 3.3 Acceptance criteria 3.4 Sample Disposition	55 °C ~ 150 °C
JESD22-A101D:2015	STEADY STATE TEMPERATURE HUMIDITY BIAS LIFE TEST (제외) 5 Failure Criteria	60 °C ~ 85 °C 65 % R.H. ~ 85 % R.H.
JESD22-A102E:2015	ACCELERATED MOISTURE RESISTANCE UNBIASED AUTOCLAVE (제외) 5 Failure Criteria	121 °C 100 % R.H. 205 kPa
JESD22-A103E:2015	HIGH TEMPERATURE STORAGE LIFE (제외) 4.2 Measurements 4.3 Failure criteria	55 °C ~ 300 °C
JESD22-A104E:2015	TEMPERATURE CYCLING (제외) 5.9 Measurements 6 Failure criteria	-65 °C ~ 150 °C
JESD22-A105C:2004	POWER AND TEMPERATURE CYCLING (제외) 4.4 Measurements 5 Failure criteria	-40 °C ~ 125 °C
JESD22-A108D:2010	TEMPERATURE, BIAS, AND OPERATING LIFE (제외) 6 Measurements 7 Failure criteria	-40 °C ~ 160 °C
JESD22-A110E:2015	HIGHLY ACCELERATED TEMPERATURE AND HUMIDITY STRESS TEST (HAST) (제외) 5 Failure criteria	110 °C ~ 130 °C 85 % R.H. ~ 100 % R.H. 122 kPa ~ 230 kPa



제KT219호 (3/3)

03.014 환경 및 신뢰성(계속)

규격번호	규격명	시험범위 또는 검출한계
JESD22-A113G:2015	PRECONDITIONING OF NONHERMETIC SURFACE MOUNT DEVICES PRIOR TO RELIABILITY TESTING (제외) 4.1 Initial electrical test 4.10 Final electrical test	30 °C ~ 125 °C 30 % R.H. ~ 85 % R.H. Peak Temp.: Max. 300 °C
JESD22-A117C:2011	ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE ROM (EEPROM) PROGRAM/ERASE ENDURANCE AND DATA RETENTION TEST (제외) 4.1.3 Electrical test verification 4.4 Measurements 5 Failure criteria and calculation	55 °C ~ 150 °C
JESD22-A118B:2015	ACCELERATED MOISTURE RESISTANCE - UNBIASED HAST (제외) 5 Failure criteria	110 °C ~ 130 °C 85 % R.H. ~ 100 % R.H. 230 kPa
JESD22-A119A:2015	LOW TEMPERATURE STORAGE LIFE (제외) 3.2 Measurements 3.3 Failure Criteria	-40 °C ~ -65 °C
JESD22-B101C:2015	EXTERNAL VISUAL (제외) 6 Failure criteria	Max. 100 X
JESD74A:2007	EARLY LIFE FAILURE RATE CALCULATION PROCEDURE FOR SEMICONDUCTOR COMPONENTS (제외) 4.4 Failure analysis	55 °C ~ 150 °C
IPC/JEDEC J-STD-020E: 2014	MOISTURE/REFLOW SENSITIVITY CLASSIFICATION FOR NONHERMETIC SOLID STATE SURFACE MOUNT DEVICES (제외) 3.6 Electrical test 5.2 Initial electrical test 5.8 Final electrical test	30 °C ~ 125 °C 30 % R.H. ~ 85 % R.H. Peak Temp.: Max. 300 °C

끝.